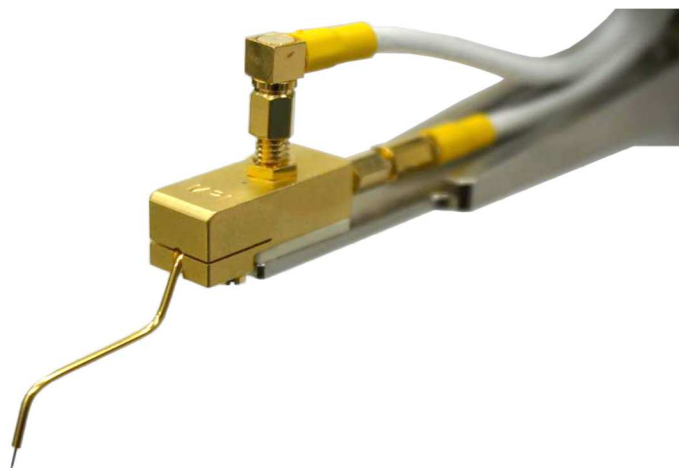


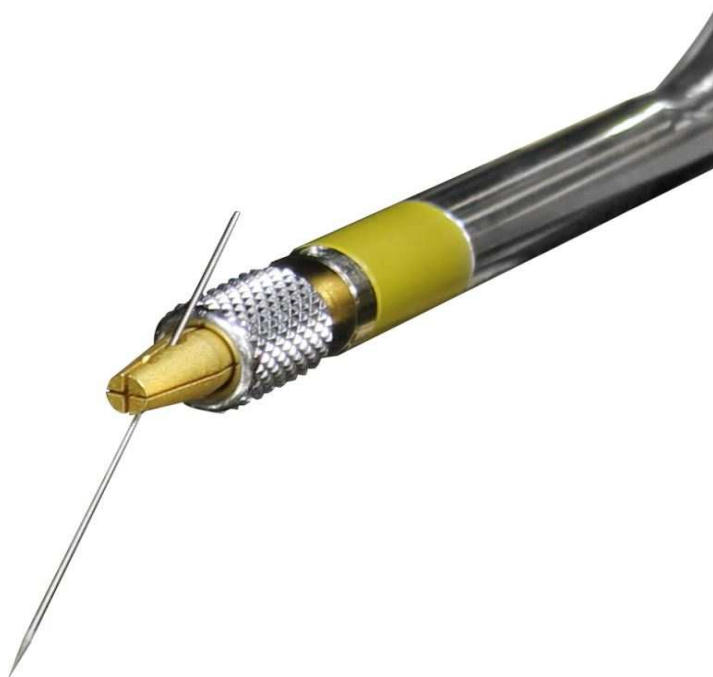
MPI Übersicht Prüfnadeln und Probes

Geschirmte KELVIN Probe



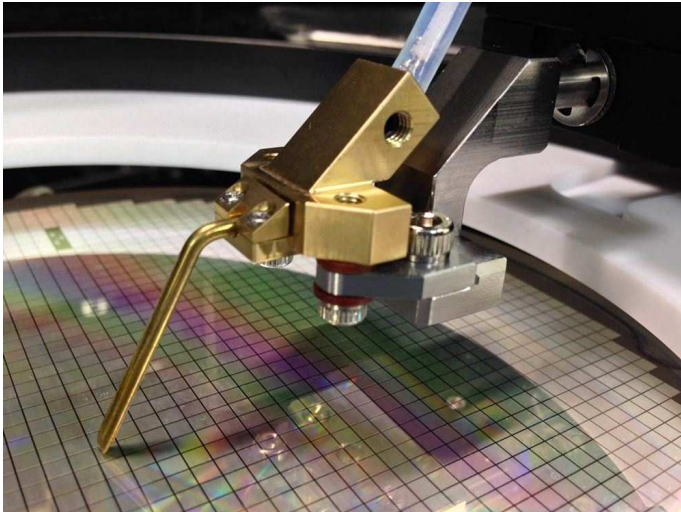
Wie aus dem Bild ersichtlich reicht die koaxiale Schirmung bis etwa 2mm vor die Prüfspitze. Der Schirm kann auf LO oder auf GUARD Potential gelegt werden. Mit Kelvin Probes lassen sich empfindliche Messungen durch die exzellente Schirmung sehr einfach durchführen. Das Signal/Rauschverhältnis verbessert sich wesentlich.

Hochspannungprobe bis 10kVdc



Mit den HV Probes von MPI lassen sich Hochspannungsmessungen direkt am Wafer bis 10kV realisieren. Die Kontaktstifte lassen sich einfach durch Führungskanäle in verschiedenen Winkeln montieren.

Hochstromprobe bis 100A



Moderne Halbleiter wie IGBT's können hohe Ströme sehr rasch ein- und ausschalten. Um dies zu messen müssen hohe Testströme direkt am Wafer mit Kontaktstiften eingepreßt werden. Die Hochstromproben von MPI sind für Ströme bis 100A geeignet.

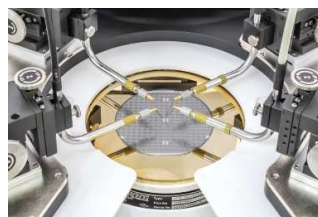
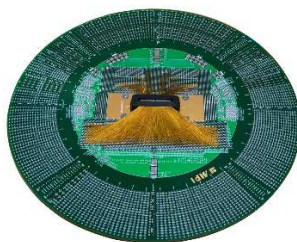
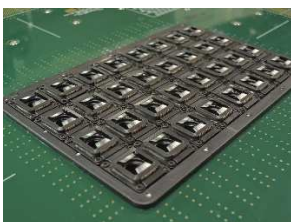
Hochfrequenz Probes von 26 – 110 GHz



RF-Probes der TITAN™ - Serie von MPI sind in „single ended“ oder „dual-tip“ Konfiguration erhältlich. Durch die präzise Fertigung in MEMS Technologie ist eine konstante Impedanz von 50Ω gewährleistet. Der Kontaktabstand reicht 50µ bis 1250µ, die Dauerbelastung reicht bis 10Watt. TITAN™ Probes können bis 110GHz bzw Millimeterwave - Anwendungen eingesetzt werden und eignen sich hervorragend für on-wafer S-Parameter Messungen.



Nadelkarten und Sonderanfertigungen



MPI fertigt auch spezielle Nadelkarten und Verdrahtungen („pin-mapping“) nach Kundenwunsch. Kontaktieren Sie uns unter office@smt.at . Gerne besprechen wir die Details und Anforderungen ihrer Anwendung.